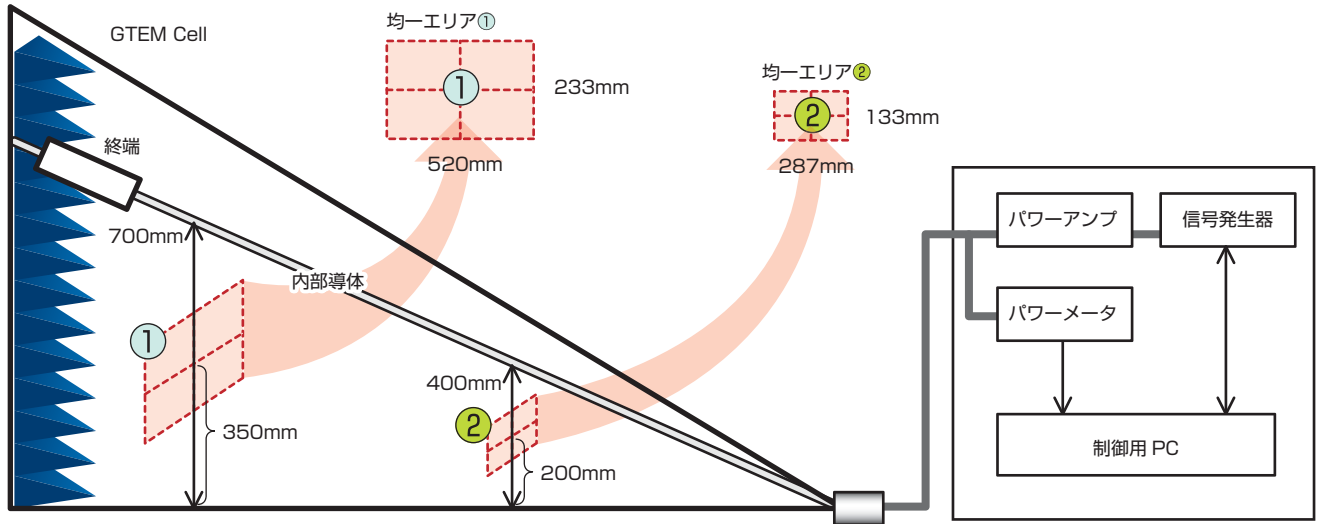


TEM cell イミュニティ試験 (G-TEM cell)

搭載電子機器が強い電磁界ノイズに曝された際の耐性を評価する試験システムです。



均一エリア①、②共に約 ±3dB の範囲です。

試験周波数範囲：10kHz ~ 3GHz

電界強度：校正エリア 10kHz ~ 1GHz：校正エリア① 100V/m、校正エリア② 200V/m (いずれも無変調時)

1GHz ~ 2GHz：校正エリア② 100V/m (無変調時)

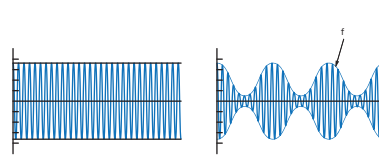
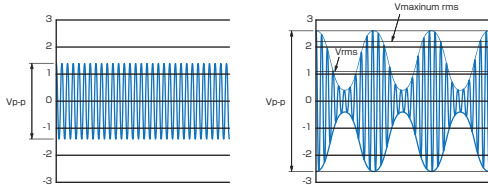
2GHz ~ 3GHz 度：校正エリア② 80V/m (無変調時)

電界強度の校正はパワーメーターによる電力管理にて行っています。

AM 変調方式には、主に以下の2種類があります。(いずれも左が無変調。右が AM 変調)

■ IEC61000-4-3 規格にて採用されている方式

■ ISO 11452 で採用されている方式 (ピーク制御)



※IECの方はAM変調時のVp-pが無変調時のVp-pより変調率分大きくなっています。それに対して、ISOの方はAM変調時、無変調時共にVp-pは同じです。
どちらも無変調時のレベルが100V/mであれば、XX%のAM変調をかけた場合、「100V/m、AMXX%変調」という表現を用います。

想定される脅威は？

- ラジオ、トランシーバ、アマチュア無線、及び携帯電話などの無線電波
- 違法無線

どんな試験？

GTEM cell 内の中心導体と外部導体の間に供試品を設置し、その間で発生する電磁界に曝し既定の周波数・試験レベルで耐性を評価します。

TEM cell イミュニティ試験 (GTEM cell)

試験イメージ

